

このアノマリ・リストでは、ADuC7032-8L 高精度統合バッテリー・センサーの既知のバグ、アノマリ、対策について説明します。ここに記載するアノマリは、次のようにパッケージにマーキングされたすべての ADuC7032-8L に適用されます。

1行目 ADuC7032

2行目 BSTZ96 8L

アナログ・デバイセズは、将来のシリコン・レビジョンで、シリコン機能を続けて改善する方針でおります。アナログ・デバイセズは、これらの将来シリコン・レビジョンがここに記載する推奨対策を実施することにより、ユーザーの現在のソフトウェア/システムとの互換性を維持することができるように努力します。

ADuC7032-8L の機能上の問題

シリコン レビジョン 識別	カーネル レビジョン 識別	チップ・マーキング	シリコン ステータス	アノマリ・シート	アノマリ報告数
8L	A60	ADuC7032 BSTZ96 8L	リリース	Rev. 0	2

ADuC7032-8L の性能上の問題

シリコン レビジョン 識別	カーネル レビジョン 識別	チップ・マーキング	シリコン ステータス	アノマリ・シート	アノマリ報告数
8L	A60	ADuC7032 BSTZ96 8L	リリース	Rev. 0	2

Rev. 0

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。
※日本語データシートは REVISION が古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。
©2007 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

アノマリ

ADuC7032-8L の機能上の問題

1. 31 V を超える VDD での LIN 通信[er001]:

背景:	ADuC7032-8L は最大 40 V の動作仕様です。
問題:	VDD > 31 V で LIN 通信を行うと、ADuC7032-8L がリセットされる。
対策:	保留中。
関連する問題:	なし。

2. LIN 短絡検出[er002]:

背景:	ADuC7032-8L は LIN 短絡保護機能を内蔵しています。LIN バスで短絡が発生した場合、割り込みが発生します。HVCFG1[2] を使うと、ユーザーはこの割り込みをイネーブル/ディスエーブルすることができます。デフォルトでは、イネーブルされています。
問題:	LIN を 120 Ω より小さい抵抗で VDD に短絡すると、温度と電源によっては LIN で発振が生じて、短絡が検出されなくなる。
対策:	保留中。
関連する問題:	なし。

アノマリ

ADuC7032-8L の性能上の問題

1. ESD [pr001]:

背景:	ADuC7032-8L は、2 kV の HBM ESD 定格と 500 V の FICDM ESD 定格に分類されるようになっています。
問題:	8L、HBM ESD と表示されたシリコンは 800 V として、FICDM ESD は 400 V さらにコーナー・ピンに対しては 750 V として、それぞれ仕様が規定されています。
対策:	保留中。
関連する問題:	なし。

2. WU ピンのラッチアップ[pr002]:

背景:	WU ピンのラッチアップ条件は AECQ100 規定に準拠するため、125°C で最大 -100 mA のシンク電流を許容できる必要があります。
問題:	WU ピンが AECQ100 規定を満たさない。
対策:	BAS52 のような保護ダイオードを図 1 のように接続して、デバイスの損傷を防止することが推奨されます。

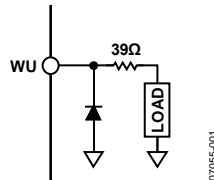


図 1. WU ピンに対する保護ダイオードの接続

関連する問題:	なし。
---------	-----

セクション 1. ADuC7032-8L の機能上の問題

参照番号	説明	ステータス
er001	VDD > 31 V での LIN 通信	オープン
er002	LIN 短絡検出	オープン

セクション 2. ADuC7032-8L の性能上の問題

参照番号	説明	ステータス
pr001	ESD	オープン
pr002	WU ピンのラッチアップ	オープン